# Адиабатические модули упругости в кристаллах ZnSe: Mn<sup>2+</sup> и ZnSe: V<sup>2+</sup>

© В.В. Гудков\*\*\*\*, А.Т. Лончаков\*\*\*, В.И. Соколов\*\*\*, И.В. Жевстовских\*\*\*, В.Т. Суриков\*\*\*\*

\* Российский государственный профессионально-педагогический университет,

620012 Екатеринбург, Россия

\*\* Уральский государственный технический университет (УПИ),

620002 Екатеринбург, Россия

\*\*\* Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук,

620041 Екатеринбург, Россия

\*\*\*\* Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук,

620041 Екатеринбург, Россия

E-mail: gudkov@imp.uran.ru

В кристаллах ZnSe: V<sup>2+</sup> (концентрация примеси  $6 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ) и ZnSe: Mn<sup>2+</sup> ( $9.4 \cdot 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ) в интервале 1.4-100 K измерены температурные зависимости модулей упругости  $C_{44}$ ,  $(C_{11} - C_{12})/2$  и  $C_l = (C_{11} + C_{12} + 2C_{44})/2$  на частоте 52 и 156 MHz. Восстановлены температурные зависимости адиабатических модулей упругости. Установлено, что смягчение симметрийных модулей наблюдается лишь в кристалле с примесью, имеющей орбитально вырожденные состояния.

Работа выполнена по плану РАН (тема № г.р. 01.02.006 133395), при частичной поддержке РФФИ (грант № 04-02-96094-р2004 урал\_а).

PACS: 43.35.+d, 61.72.Vv, 64.70.Kb

## 1. Введение

Первые работы по исследованию эффекта Яна-Теллера ультразвуковыми методами в основном были посвящены температурным зависимостям поглощения [1-3]. Одним из важных результатов этих исследований оказалась возможность по форме кривой поглощения восстановить температурную зависимость  $\tau$  — времени релаксации 3*d*-электронной подсистемы примеси. Моделирование этой зависимости позволило определить механизмы релаксации и ряд важных физических параметров, высоту потенциального барьера, деформационный потенциал и некоторые другие. Детально процедура восстановления  $\tau(T)$  описана в монографии [4].

Дополнительная информация может быть получена из данных о температурных зависимостях фазовой скорости ультразвуковых волн определенной поляризации или связанных с ними компонент тензора упругих модулей (см., например, [5]). Локальные деформации решетки являются результатом изменения определенных сил, действующих между ян-теллеровским ионом и окружением. Направление этих сил задает тип вибронных мод и характер локальных деформаций. В кристаллах, имеющих структуру цинковой обманки, в силу симметрийных соображений допускаются моды є- и *т*<sub>2</sub>-типа. Возникающие при этом деформации имеют тетрагональный или тригональный тип соответственно. На макроскопическом уровне изменение локальных сил проявляется в изменении определенного упругого модуля [6]. Таким образом, тип локальных деформаций коррелирует с модулем, который изменяется. Иными словами, измерение температурных зависимостей таких феноменологических параметров, как упругие модули,

дает возможность определить тип вибронных мод и характер локальных искажений, т. е. получить информацию о параметрах, заданных на уровне элементарной ячейки. Это оказывается возможным, поскольку локальные деформации понижают симметрию окружения примеси, и это проявляется в соответствующем симметрийном упругом модуле. В кристаллах, имеющих структуру цинковой обманки, смягчение модуля  $C_{44}$  указывает на тригональные деформации, а модуля  $C_{5t} = (C_{11} - C_{12})/2$  на тетрагональные. Упругие модули могут быть измерены с высокой точностью (порядка  $10^{-6}$ ), поэтому влияние примесей даже малой концентрации может быть исследовано в ультразвуковом эксперименте.

Исходные данные таких экспериментов относятся к динамическим модулям, т.е. к модулям, зависящим от частоты. В теоретических расчетах, в которых рассматривается внутренняя или свободная энергия, в результате дифференцирования получают частотно-независимые модули: адиабатические  $C^{S}$  или изотермические  $C^{T}$ .

Взаимодействие ультразвука с какой-либо подсистемой кристалла может носить резонансный либо релаксационный характер. В экспериментальных работах, указанных выше, признаков резонансного взаимодействия обнаружено не было. Поэтому в дальнейшем будем обсуждать релаксационный характер взаимодействия. В этом случае в окрестности  $\omega \tau = 1$  ( $\omega$  — циклическая частота) наблюдаются аномалии поглощения  $\alpha$  и фазовой скорости  $\upsilon$  ультразвука. Поглощение имеет форму пика, а изменение скорости отражает переход динамического модуля C от релаксационного  $C^R = C(\omega \tau \to 0)$ к нерелаксированному  $C^U = C(\omega \tau \to \infty)$ . Удобно представить динамический модуль упругости C как сумму вклада от релаксационного процесса  $C_r$  и остальной части  $C_b$ . Вторая составляющая также может иметь релаксационный характер, но с существенно отличным временем релаксации  $\tau_b$ , а значит, иметь аномалии в другой области температур. В случае  $\omega \tau_b \gg 1 \quad C^U$  представляет модуль, близкий к адиабатическому, а при  $\omega \tau_b \ll 1 \quad C^R$  — модуль, близкий к изотермическому.

На частотах порядка  $10^8$  Hz в большинстве случаев можно считать, что  $C_b$  является адиабатическим, поэтому если определить зависимость  $C^U(T)$ , то она была бы температурной зависимостью адиабатического модуля упругости  $C^S$  в данном кристалле.

Ранее нами был предложен способ определения зависимостей  $C^{U}(T)$  и  $C^{R}(T)$  [7]. Он предполагает измерение поглощения  $\alpha(T)$  и скорости v(T) ультразвука и расчет модулей по формулам

$$\frac{C^U - C_0}{C_0} = 2\left[\frac{\Delta v(T)}{v_0} + \frac{\alpha_r(T)}{k_0}\frac{1}{\omega\tau}\right],\tag{1}$$

$$\frac{C^R - C_0}{C_0} = 2 \left[ \frac{\Delta v(T)}{v_0} - \frac{\alpha_r(T)}{k_0} \,\omega \tau \right],\tag{2}$$

где  $k_0 = \omega/v_0$  — волновое число,  $\alpha_r$  — вклад релаксационного процесса в общее поглощение. В наших экспериментах  $\alpha_r = \alpha(T) - \alpha(0)$ , где  $\alpha(0) = \alpha(T \to 0)$  экстраполированное на нулевую температуру значение поглощения. Динамический модуль  $C_0$  и фазовая скорость  $v_0$  определены при некоторой температуре  $T_0$ .

Данная процедура, а также метод восстановления  $\tau(T)$  были применены нами при исследовании кристаллов ZnSe:Ni<sup>2+</sup> [7] и ZnSe:Cr<sup>2+</sup> [8]. В этих кристаллах было обнаружено смягчение симметрийных модулей: C<sub>44</sub> в кристалле, допированном Ni, и  $C_{\rm st} = (C_{11} - C_{12})/2$  — в кристалле с примесью Cr. В рамках представлений об эффекте Яна-Теллера это обстоятельство можно объяснить возникновением тригональных и тетрагональных деформаций в окрестности примеси, имеющей орбитально вырожденные 3d-состояния. Представлялось интересным исследовать влияние других примесей 3*d*-элементов, как имеющих, так и не имеющих орбитально вырожденные состояния в этой же матрице. С этой целью были выполнены ультразвуковые исследования кристаллов ZnSe: V<sup>2+</sup> с триплетным основным состоянием  ${}^{4}T_{1}$  (электронная конфигурация  $e^2t^1$ ) и ZnSe: Mn<sup>2+</sup>, основное состояние которого синглетное  ${}^{6}A_{1}(e^{2}t^{3})$  [9]. В настоящей работе изложены результаты этих исследований.

# 2. Эксперимент

Монокристаллы ZnSe: V<sup>2+</sup> и ZnSe: Mn<sup>2+</sup> были выращены в Институте физики твердого тела РАН методом Бриджмена из расплава в условиях избыточного давления интертного газа [10]. Концентрации примесей  $n_{\rm V} = 6 \cdot 10^{18}$  cm<sup>-3</sup> и  $n_{\rm Mn} = 9.4 \cdot 10^{20}$  cm<sup>-3</sup> были определены методом масс-спектроскопии (Spectromass 2000) с индуктивно связанной плазмой.



Рис. динамических 1. Температурные зависимости модулей упругости. 1 \_  $\Delta C_{44}/C_{44}$ в кристалле ZnSe: Mn<sup>2+</sup>; 2 —  $\Delta C_{44}/C_{44}$  B ZnSe: V<sup>2+</sup>; 3 —  $\Delta C_l/C_l$  B ZnSe: Mn<sup>2+</sup>; 4 —  $\Delta C_l/C_l$  B ZnSe: V<sup>2+</sup>; 5 —  $\Delta C_{st}/C_{st}$  B ZnSe:  $Mn^{2+}$ ;  $6 - \Delta C_{st}/C_{st}$  b ZnSe:  $V^{2+}$ . Частота 52 MHz.  $\Delta C_i/C_i = (C_i(T) - C_i(T_0))/C_i(T_0)$ . Для кристалла ZnSe:V<sup>2+</sup>  $T_0 = 4.2 \, \text{K}$ . Графики для кристалла ZnSe: Mn<sup>2+</sup> смещены так, чтобы одинаковые модули разных кристаллов совпадали при  $T = 100 \, \text{K}.$ 

Измерения были выполнены на установке, работающей по принципу высокочастотного моста, обеспечивающей точность определения изменения поглощения в зависимости от внешнего параметра (в данном случае — температуры) не менее 0.02 dB, а скорости — порядка  $10^{-6}$ . Ультразвуковые радиоимпульсы длительностью 0.7  $\mu$ s распространялись вдоль направления [110]. В этом направлении образцы имели длину около 5 mm. Использовались несущие частоты 52 и 156 MHz.

Время релаксации определялось по формуле

$$\tau(T) = \frac{1}{\omega} \left( \frac{\alpha_1 T_1}{\alpha_r(T)T} \right) \pm \sqrt{\left( \frac{\alpha_1 T_1}{\alpha_r(T)T} \right)^2 - 1}, \quad (3)$$

где  $T_1$  — температура, при которой  $\omega \tau = 1$ ,  $\alpha_1 = \alpha_r(T_1)$ .

Низкотемпературное смягчение (рис. 1) было обнаружено для модулей  $C_{44}$  и  $C_l = (C_{11} + C_{12} + 2C_{44})/2$ в кристалле с примесью V. Очевидно, что смягчение модуля  $C_l$  происходит за счет того, что  $C_{44}$  входит в  $C_l$  слагаемым. Важным обстоятельством является то, что модуль  $C_{st}$  смягчения не проявил. Следовательно, локальные деформации в кристалле ZnSe: V<sup>2+</sup> имеют тригональный тип. Также не проявили смягчения и все модули кристалла с примесью Mn, подтверждая ян-теллеровскую природу ультразвуковых аномалий в кристаллах ZnSe: V<sup>2+</sup>, ZnSe: Ni<sup>2+</sup> и ZnSe: Cr<sup>2+</sup>.

Рис. 2 и 3 показывают температурные зависимости релаксированных и нерелаксированных модулей в кристалле  $ZnSe:V^{2+}$ , полученные в результате обработки данных о поглощении и скорости ультразвука по формулам (1)–(3). Видно, что на частоте 156 MHz



**Рис. 2.** Нерелаксированный (адиабатический), динамический, измеренный на частоте 52 MHz, и релаксированный модули  $C_{44}$  в кристалле ZnSe: V<sup>2+</sup> как функции обратной температуры.  $I - \Delta C_{44}^U/C_{44}$ ,  $2 - \Delta C_{44}/C_{44}$ ,  $3 - \Delta C_{44}^R/C_{44}$ .  $\Delta C_{44}^i/C_{44} = (C_{44}^i(T) - C_{44}(T_0))/C_{44}(T_0)$ ,  $T_0 = 4.2$  K.



**Рис. 3.** Нерелаксированный (адиабатический), динамический, измеренный на частоте 156 MHz, и релаксированный модули  $C_l$  в кристалле ZnSe: V<sup>2+</sup> как функции обратной температуры.  $1 - \Delta C_l^U/C_l$ ,  $2 - \Delta C_l/C_l$ ,  $3 - \Delta C_l^R/C_l$ .  $\Delta C_l^R/C_l = (C_l^i(T) - C_l(T_0))/C_l(T_0)$ ,  $T_0 = 4.2$  K.

динамический модуль упругости в исследованном интервале температур трансформируется из релаксированного в нерелаксированный. На частоте 52 MHz этого не происходит в полной мере, поскольку с частотой температура  $T_1$  уменьшается, а вместе с ней понижается и температура области такой трансформации.

### 3. Заключение

К основным результатам наших исследований кристаллов ZnSe:  $V^{2+}$ , ZnSe:  $Mn^{2+}$  можно отнести следующие.

Показано, что низкотемпературного смягчения модулей не наблюдается в кристалле с синглетным состоянием 3*d*-примеси, что поддерживает интерпретацию обнаруженных в кристаллах  $ZnSe: V^{2+}$ ,  $ZnSe: Ni^{2+}$  и  $ZnSe: Cr^{2+}$  аномалий как проявление эффекта Яна–Теллера. Установлено, что локальные деформации в кристалле  $ZnSe: V^{2+}$  имеют тригональный тип. Восстановлены температурные зависимости нерелаксированного (адиабатического) и релаксированного модулей упругости.

Авторы признательны Н.Н. Колесникову за изготовление кристалла, использованного в настоящей работе.

#### Список литературы

- [1] И.Б. Берсукер. ЖЭТФ 44, 1577 (1963).
- [2] E.M. Gyorgy, M.D. Sturge, D.B. Fraser, R.C. Le Craw. Phys. Rev. Lett. 15, 19 (1965).
- [3] M.D. Sturge, J.T. Krause, E.M. Gyorgy, R.C. Le Craw, F.R. Merritt. Phys. Rev. 155, 218 (1967).
- [4] M.D. Sturge. Solid state physics. Academic Press, N.Y.-London (1967). V. 20. P. 92.
- [5] B. Luthi. Physical acoustics in the solid state. Springer, Berlin– Heidelberg–N.Y. (2004). P. 119.
- [6] Н.С. Аверкиев, Т.К. Аширов, А.А. Гуткин, Е.Б. Осипов, В.Е. Седов. ФТТ 28, 2959 (1986).
- [7] V. Gudkov, A. Lonchakov, V. Sokolov, I. Zhevstovskikh, N. Gruzdev. Phys. Status Solidi B 242, R 30 (2005).
- [8] V.V. Gudkov, A.T. Lonchakov, V.I. Sokolov, I.V. Zhevstovskikh. Phys. Rev. B 73, 035 213 (2006).
- [9] K.A. Kikoin, V.N. Flerov. Transition metal impurities in semiconductor: electronic structure and physical properties. World Scientific, Singapore (1994). P. 163.
- [10] М.П. Кулаков, А.В. Фадеев, Н.Н. Колесников. Изв. АН СССР. Неорган. метериалы 22, 39 (1986).